(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年9 月16 日 (16.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/079827 A1

(51) 国際特許分類7: H01L 29/82, 43/08, 27/105

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/000567

(22) 国際出願日:

2004年1月23日(23.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

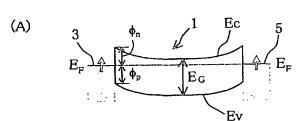
特願2003-062453 特願2003-164398 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県 川口市本町四丁目 1 番 8 号 Saitama (JP).

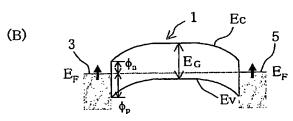
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菅原 聡 (SUGA-HARA, Satoshi) [JP/JP]; 〒2310821 神奈川県横浜市中区本牧原21-1-603 Kanagawa (JP). 田中雅明 (TANAKA, Masaaki) [JP/JP]; 〒3360921 埼玉県さいたま市緑区井沼方647-6-201 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 平木 祐輔 , 外(HIRAKI, Yusuke et al.); 〒 1050001 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門5森 ビル 3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: FIELD-EFFECT TRANSISTOR WITH SPIN-DEPENDENT TRANSMISSION CHARACTERISTIC AND NONVOLATILE MEMORY USING SAME

(54) 発明の名称: スピン依存伝達特性を有する電界効果トランジスタ及びそれを用いた不揮発性メモリ





(57) Abstract: When a gate voltage V_{GS} is applied, the Schottky barrier width due to the metallic spin band in the ferromagnetic source is decreased, and up-spin electrons from the metallic spin band are tunnel-injected into the channel region. However, downspin electrons from the nonmagnetic contact (3b) are not injected because of the energy barrier due to semiconductive spin band of the ferromagnetic source (3a). That is, only up-spin electrons are injected into the channel layer from the ferromagnetic source (3a). If the ferromagnetic source (3a) and the ferromagnetic drain (5a) are parallel magnetized, up-spin electrons are conducted through the metallic spin band of the ferromagnetic drain to become the drain current. Contrarily, if the ferromagnetic source (3a) and the ferromagnetic drain (5a) are antiparallel magnetized, up-spin electrons cannot be conducted through the ferromagnetic drain (5a) because of the energy barrier Ec due to the semiconductive spin band in the ferromagnetic drain (5a). Thus, a high-performance high-degree of integration nonvolatile memory composed of MISFETs operating on the above operating principle can be fabricated.

[!] (57) 要約: ゲート電圧V_{GS}の印加によって、強磁性ソースにおける金属的スピンバンドによるショットキー障壁幅) が滅少し、この金属的スピンバンドからのアップスピン電子がチャネル領域にトンネル注



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH,

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。